Министерство науки
и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Институт дистанционного
и дополнительного образования

**АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

повышения квалификации

«Диагностика структуры и свойств кристаллических материалов с использованием акустических, оптических и рентгеновских методов»,

Раздел(предмет) *Диагностика структуры и свойств кристаллических материалов с использованием акустических, оптических и рентгеновских методов*

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Кристаллография и ее роль в современном мире</i>	Кристаллография и ее роль в современном мире. Кристаллические материалы. Классификация кристаллов. Области применения кристаллов. Проблемы диагностики и дефектоскопии кристаллических материалов.	<i>Доклад</i>	<i>71</i>
<i>Методы акустической эмиссии для диагностики и дефектоскопии кристаллических материалов</i>	Физические основы метода акустической эмиссии. Особенности применения при хрупком разрушении материалов. Методы и алгоритмы локации источников АЭ. Информационные аспекты метода АЭ, подходы к обработке диагностических данных. Критерии оценивания дефектности материалов методом АЭ – фундаментальный, эмпирический и статистический подходы. Применение метода АЭ для выявления дефектов в	<i>Доклад</i>	

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
	процессе кристаллизации. Применение метода АЭ для выявления дефектов оптических кристаллов при различных видах нагружения. Современные достижения		
<i>Оптические методы диагностики и дефектоскопии кристаллических материалов</i>	Физические основы оптических методов технической диагностики. Классификация оптических методов. Первичные информативные параметры. Схемы контроля. Контролируемые параметры. Основные типы и характеристики оптических систем. Формирование изображения оптическими системами. Методы оптической микроскопии для дефектоскопии кристаллов. Поляризационные методы диагностики кристаллов. Интерференционные методы диагностики кристаллов. Акустооптические методы диагностики кристаллов.	<i>Доклад</i>	
<i>Рентгеновские методы диагностики и дефектоскопии кристаллических материалов</i>	Рентгеновские методы диагностики и дефектоскопии кристаллических материалов. Возможности исследования кристаллических материалов рентгеновскими методами. Рентгеновская дифрактометрия и рентгеновская топография. Рентгеновская спектроскопия, рефлектометрия и другие методы. Рентгеновские исследования	<i>Доклад</i>	

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
	кристаллических материалов в условиях внешних воздействий Пути развития современных рентгеновских методов, эксперименты с временным разрешением. Комплексные подходы к изучению структуры кристаллических веществ с использованием рентгеновского излучения.		

Руководитель ДИТ

		Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
		Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец		Хвостов А.А.	
Идентификатор		Rd7c1e2e7-KhvastovAA-a55ec66d	

А.А.
Хвостов

Начальник ОДПО

		Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
		Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец		Борченко И.Д.	
Идентификатор		R78f3a961-BorchenkoID-e2a246f3	

И.Д.
Борченко